



一种采用X射线荧光光谱检测重金属的薄膜标准品的制备装置及其应用

文献类型: 专利

作者 甘婷婷¹; 张玉钧¹; 殷高方; 赵南京¹; 刘建国¹; 刘文清¹

发表日期 2016

专利号 201410616682.9

著作权人 中国科学院合肥物质科学研究院

国家 中国

文献子类 发明专利

语种 中文

源URL [http://ir.hfcas.ac.cn:8080/handle/334002/33934]

专题 合肥物质科学研究院_中科院安徽光学精密机械研究所

作者单位 中国科学院安徽光学精密机械研究所, 合肥 230031

推荐引用方式 甘婷婷,张玉钧,殷高方,等. 一种采用X射线荧光光谱检测重金属的薄膜标准品的制备装置及其应用. 201410616682.9. **GB/T 7714** 2016-01-01.

入库方式: OAI收割

来源: [合肥物质科学研究院](#)

浏览	下载	收藏
48	20	0

其他版本

除非特别说明, 本系统中所有内容都受版权保护, 并保留所有权利。